

光束质量分析仪及高分辨率波前传感器

产品名称	光束质量分析仪及高分辨率波前传感器
公司名称	武汉新特光电技术有限公司
价格	888888.00/台
规格参数	光束强度测量:连续或脉冲，XYZ三轴测 波长范围:350 1100 nm M2范围:1-50
公司地址	武汉东湖新技术开发区流芳园南路18号光电工业园产业大楼301室
联系电话	18162698939 18162698939

产品详情

BeamWave传感器在一体式设备中同时提供强度和波前测量。这些传感器不是使用微透镜阵列进行波前采样，而是基于创新的数字波前技术，因此，波前测量点的数量仅受提供高空间分辨率波前的相机分辨率的限制。BeamWave系列光束质量分析仪及高分辨率波前传感器，具有高分辨率、测量速度快、测量功能更全面，无需繁琐的导轨等优点，仅需一台BeamWave即可测量所有的激光光束参数，包括光束发散角，光斑位置大小，三维能量分布，波前能量、相位分布，波前曲率半径等。BeamWave光束质量分析仪（M2仪，激光轮廓仪）的通用性强，连续和脉冲光束都能测量，十分适合客户用于各类激光参数研究。

BeamWave系列光束质量分析仪采用的波前传感技术，它的原理是在CCD探测过程中，入射激光光斑会被分成两束激光，一快一慢分别先后的到达两个CCD探测器阵面上，得到两个光束图像。通过对比分析这两个图像的波前能量强度分布和波前相位分布可以分析出该光束的M2值、发散角、光束位置和其它传播参数。

我们的传感器配有GetLase 用于所有激光束参数和GetWave的即时诊断的GUI软件图形用户界面软件与全面的波前分析工具，包括，Zernike，MTF和PSF。已成功用于以下应用程序：

激光束实时监测, 瞬时激光束诊断，连续和脉冲光束都能测量，脉冲测量自动触发

激光二极管，光纤激光器，半导体激光器

固态激光器，激光通信组件

光学特性：微透镜和眼科透镜

产品特征

同时进行强度和波前分析：数字波前技术提供高分辨率的强度和波前

高分辨率波前测量：空间波前成像仅受相机分辨率限制，无需微透镜阵列采样

用于光束监测的一体化设备：在单个设备中包括强度分布和光束传播参数的光束剖面。只需一台BeamWave即可测量全部的光束参数，且价格相对优惠，结构简单无需维护成本。

可以同时测量分析光束形貌参数（如光束发散角，三维能量分布，光斑位置，腰斑大小）、光束传播参数（如波前曲率半径，波前能量、相位分布，锐利长度，腰斑大小和位置）、以及M2因子。

型号	STP-BeamWave500	STP-BeamWave1000
超大输入光束直径1/e ²	3.2mm	4.8mm (双CCD)
光束强度测量模式		连续或脉冲，X
波长范围		350 1100 nm
有效CCD口径	3.2mm	4.8mm
CCD像元大小		6.45 x 6.45 μm
M2测量功能		连续和脉冲
M2范围		1-50
M2精度	± 5%	± 5%
M2重复性		2%
波前测量功能		有
波前测量点数	500 × 500	1392 × 1040

波前灵敏度, rms	0.005	0.005		
波前精度, rms	0.01	0.01		
波前动态范围	1500	1500		
测量时间	实时			
重量	0.35 Kg	2.5 Kg		
尺寸	41 × 55 × 80	87 × 161 × 84 mm		
光学接口	C-Mou			
计算机接口	USB 2.0, Windows			
标配软件	GetLase	GetLase		
		GetWave		
供电	USB供电, 无			
可选项:	3ND Filter, Beam Splitter Wedges, IR Converter, 光束缩束和扩 Kit软件, GetWave软件波长从紫外到			

软件提供 **GetLase** 和 GetWave GUI 软件, 包括用于光束轮廓和波前分析的综合测量工具:

强度和波前采集

实时显示 **二维** 和 **三维** 强度、波前、PSF

Zernike 分析、低阶和高阶像差、散光等。

强度分布、XY 轮廓、质心、发散角等。

光束传播 分析

数据导出和报告